

УДК 539.215:539.211+621.315.592.3

©1994

АНИЗОТРОПИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ ОКИСИ ЦИНКА

A.B. Мельничук, Л.Ю. Мельничук, Ю.А. Пасечник

Методом дисперсионного анализа спектров инфракрасного отражения света окисью цинка, полученной гидротермальным способом, определены взаимно согласованные параметры монокристалла ZnO. Измерены коэффициенты анизотропии эффективных масс электронов $m_{\perp}^*/m_{\parallel}^* = 1.15$ и коэффициентов затухания плазмонов $\gamma_{p\perp}/\gamma_{p\parallel} = 1.1$. Получены зависимости коэффициентов затухания оптических фононов ZnO γ_{ph} от частоты плазменного резонанса ν_p , которые изменились с 11 до 40 cm^{-1} с увеличением ν_p от 90 до 2115 cm^{-1} . Обнаружена полоса колебаний на частоте 504 cm^{-1} , интенсивность которой зависит от ориентации кристалла. При использовании $m_{\perp}^* = 0.26m_e$ полученные значения для подвижности электронов и удельной электропроводности ZnO хорошо согласуются с литературными данными.

Окись цинка — одно из соединений, широко используемое в науке и технике благодаря его уникальным физико-химическим свойствам. Оптические и люминесцентные свойства ZnO в видимом и ультрафиолетовом диапазонах изучены достаточно хорошо, однако работ по изучению свойств монокристаллов ZnO в инфракрасном (ИК) диапазоне мало [1]. Немногочисленные данные, полученные на основании изучения спектров ИК отражения, весьма противоречивы [2,3]. Так, в работе [2] утверждается отсутствие анизотропии электрофизических параметров монокристаллов ZnO. Авторы [3] на основе анализа данных спектров комбинационного рассеяния света (КРС) работы [4] и экспериментальных спектров ИК отражения показали наличие анизотропии колебательных спектров окиси цинка. Вопрос об анизотропии эффективной массы электронов и коэффициентов затухания плазмонов, подвижности и электропроводности монокристаллов остался открытым.

Целью данной работы явилось получение коэффициентов анизотропии эффективной массы электронов и коэффициентов затухания плазмонов методом дисперсионного анализа спектров ИК отражения монокристаллов ZnO в области плазмон-фононного взаимодействия. На основании полученных данных рассчитаны подвижности электронов и удельная электропроводность окиси цинка в зависимости от ориентации кристалла.

Окись цинка (цинкит) ZnO является полупроводником с пространственной группой вюрцитта $P6_3mc$. Элементарная ячейка состоит из двух молекул ZnO. Атомы кислорода образуют плотную гексагональную упаковку. Атомы цинка расположены в центрах тетраэдров, обра-

зованных атомами кислорода. Периоды ячеек при комнатной температуре ($T = 293$ К) $a = 0.3249858$, $C = 0.52066$ нм. В [1] показано, что наиболее перспективным методом роста кристаллов ZnO является гидротермальный метод, который позволяет получать достаточно совершенные большого размера монокристаллы. В данной работе использованы кристаллы ZnO n -типа, выращенные методом гидротермального синтеза на затравку из высокотемпературного водного раствора, содержащего 5 м МОН и 1.2 м LiOH при температуре 543 К при перепаде температур $\Delta T = 40$ К и давлении 51 МПа. Образцы ZnO представляют собой прямоугольные параллелепипеды $10 \times 8 \times 8$ мм с гранями, две из которых нормальны оси С. Экспериментальные спектры ИК отражения $R(\nu)$ в области частот 200–4000 см⁻¹ измерены при помощи спектрометра SPECORD-M80 и приставки для отражения с использованием эталонного зеркала. Спектры $R(\nu)$ записаны с поляризатором со степенью поляризации $P = 0.98$ при ориентациях электрического вектора излучения $E \perp C$ и $E \parallel C$. Значение коэффициента отражения $R(\nu)$ получено с точностью 1–2%. Разрешающая способность в указанном диапазоне 1 см⁻¹.

Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты $\epsilon(\nu)$ в области плазмон-фононного взаимодействия представлена в следующем виде [5]:

$$\epsilon(\nu) = \epsilon_1(\nu) + i\epsilon_2(\nu) =$$

$$= \epsilon_\infty + [\epsilon_\infty (\nu_L^2 - \nu_T^2)] / [\nu_T^2 - \nu^2 - i\nu\gamma_{ph}] - (\nu_p^2 \epsilon_\infty) / [\gamma(\nu + i\gamma_p)],$$

ϵ_∞ — высокочастотная диэлектрическая проницаемость; ν_L , ν_T — частоты продольного и поперечного оптических фононов; γ_{ph} — коэффициент затухания оптического фонона; ν_p — частота плазменного резонанса; γ_p — коэффициент затухания плазмонов. Учет анизотропии свойств плазмонов и дисперсионный анализ спектров проведены аналогично [6].

Расчеты ИК спектров отражения $R(\nu)$ проведены по известной формуле

$$R(\nu) = \left[\left(\sqrt{\epsilon(\nu)} - 1 \right) / \left(\sqrt{\epsilon(\nu)} + 1 \right) \right]^2.$$

Выбраны модели «полубесконечного» кристалла и системы тонкий поглощающий слой—монокристалл. Сравнение спектров проведено методом наименьших квадратов при регистрации среднего по всем точкам квадратичного отклонения δ расчетного $RT(\nu)$ от экспериментального $RE(\nu)$ [6].

Анализ спектров ИК отражения $R(\nu)$ и КРС монокристаллов окиси цинка, полученных в работах [2–4, 7, 8], показал, что на основе дисперсионного анализа экспериментальных спектров ИК отражения в области

Таблица 1

Взаимосогласованные параметры одноосцилляторной модели монокристалла ZnO, использованные в расчетах ($T = 293$ К)

ZnO	ϵ_0	ϵ_∞	ν_T , см ⁻¹	ν_L , см ⁻¹
$E \perp C$	8.1	3.95	412	591
$E \parallel C$	9.0	4.05	380	570

остаточных лучей можно получить взаимно согласованные данные об оптических параметрах кристалла в данном диапазоне частот. При расчете спектров $R(\nu)$ мы использовали параметры для одноосцилляторной модели ZnO (табл. 1).

На рис. 1 показаны экспериментальные спектры ZO2-3 при $E \perp C$ и $E \parallel C$ (1, 2 — точки), при расчете $R(\nu)$ (линии 3, 4) на ПЭВМ варьировались частота и коэффициент затухания плазмонов. Четко зарегистрирована анизотропия оптических свойств кристалла. Различие при $E \perp C$ и $E \parallel C$ наблюдается и в области минимума $R(\nu)$ (рис. 1, вставка). Плазменные частоты оказались небольшими: $\nu_{T\perp} = 90$ и $\nu_{T\parallel} = 100 \text{ cm}^{-1}$. На слабо легированном образце ZO2-3 проверялись параметры, представленные в табл. 1. Среднее квадратичное отклонение $\delta \approx 0.3\%$.

На рис. 2 (1 — точки) показан экспериментальный спектр отражения $R(\nu)$ при $E \perp C$ образца ZO6-B с более высокой концентрацией электронов. Сравнение спектров $R(\nu)$ (1 и 2) позволило оценить вели-

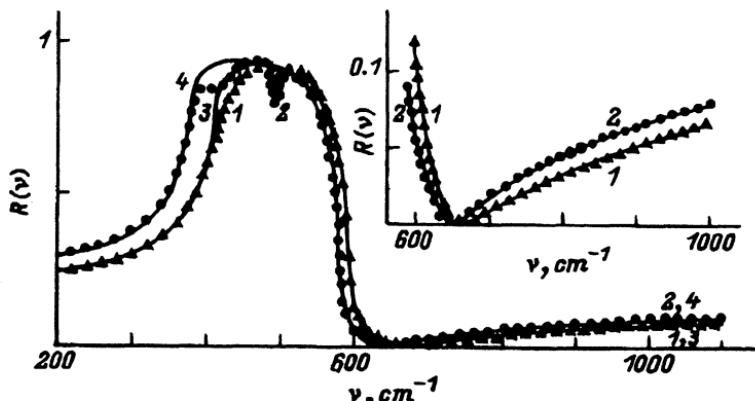


Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения ИК излучения $R(\nu)$ монокристаллов ZnO от частоты.
1 — ZO2-3 при $E \perp C$, 2 — $E \parallel C$. Расчет: 3 — $E \perp C$, $\nu_{p\perp} = 90 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{p\perp} = 150 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{ph\perp} = 11 \text{ cm}^{-1}$, $\delta = 2.9 \cdot 10^{-3}$; 4 — $E \parallel C$, $\nu_{p\parallel} = 100 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{p\parallel} = 170 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{ph\parallel} = 11 \text{ cm}^{-1}$, $\delta = 2.9 \cdot 10^{-3}$. На вставке — $R(\nu)$, увеличено в 5 раз.

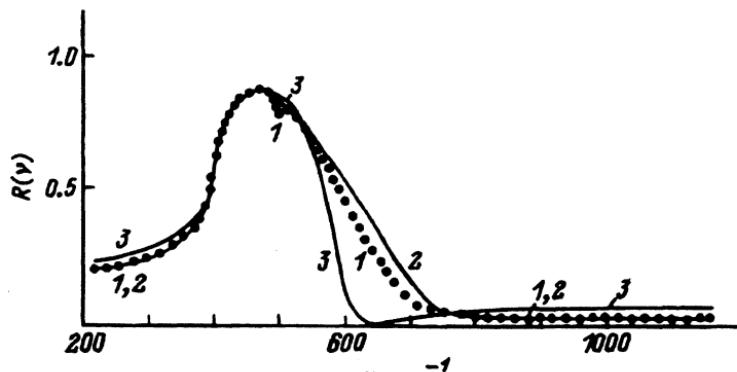


Рис. 2. $R(\nu)$ ZnO.

1 — ZO6-B при $E \perp C$. Расчет: 2 — $\nu_{p\perp} = 420 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{p\perp} = 406 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{ph\perp} = 21 \text{ cm}^{-1}$, $\delta = 3.1 \cdot 10^{-3}$; 3 — $\nu_{p\perp} = \gamma_{p\perp} = 5 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{ph\perp} = 21 \text{ cm}^{-1}$.

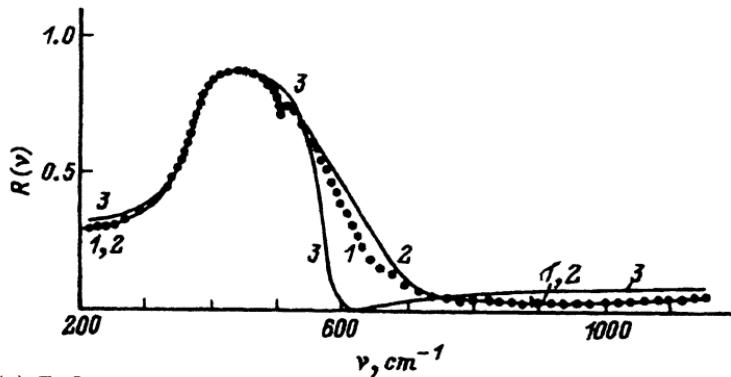


Рис. 3. $R(\nu)$ ZnO.

1 — ZO6-B при $E \parallel C$. Расчет: 2 — $\nu_{p\parallel} = 480 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{p\parallel} = 350 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{ph\parallel} = 21 \text{ cm}^{-1}$, $\delta = 3.2 \cdot 10^{-3}$; 3 — $\nu_{p\parallel} = \gamma_{p\parallel} = 5 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{ph\parallel} = 21 \text{ cm}^{-1}$.

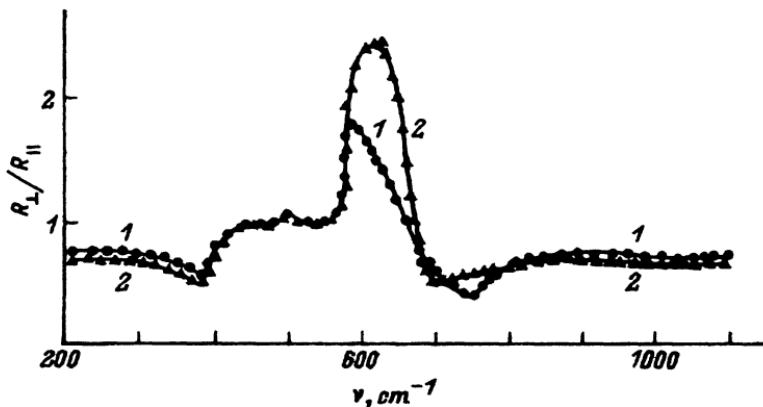


Рис. 4. Отношение экспериментальных спектров $R_\perp(\nu)/R_{\parallel}(\nu)$.

1 — ZO2-3, 2 — ZO1-3.

чины $\nu_{p\perp} = 420 \text{ cm}^{-1}$ и $\gamma_p = 406 \text{ cm}^{-1}$ при $\gamma_{ph} = 21 \text{ cm}^{-1}$ с отклонением $\delta = 3.1 \cdot 10^{-3}$. На рис. 3 представлено сравнение $RE(\nu)$ и $RT(\nu)$ образца ZO6-B при $E \parallel C$. Получены параметры $\nu_{p\parallel} = 480 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{p\parallel} = 350 \text{ cm}^{-1}$ и $\gamma_{ph\parallel} = 21 \text{ cm}^{-1}$ с отклонением $\delta = 3.2 \cdot 10^{-3}$.

Анизотропия свойств слабо и сильно легированных образцов видна на рис. 4. Кривые 1 и 2 соответствуют отношению $R_\perp(\nu)/R_{\parallel}(\nu)$ образцов ZO2-3 и ZO1-3. Характерные особенности анизотропии свойств решетки ($R_\perp/R_{\parallel} < 1$) проявляются на частотах $200\text{--}560$ и $700\text{--}1100 \text{ cm}^{-1}$, где форма кривых 1 и 2 близка друг к другу. Четко зарегистрировано отличие 1 и 2 в диапазоне $580\text{--}660 \text{ cm}^{-1}$, связанное с анизотропией колебательного спектра кристалла, с разными концентрациями электронов в этих образцах и с анизотропией свойств плазмы носителей зарядов. Анизотропия оптических свойств плазмонов проявляется в разных значениях для ν_p и γ_p при $E \perp C$ и $E \parallel C$ слабо и сильно легированных образцах. Расчеты показывают, что для образца ZO2-3 $\nu_p = 90 \text{ cm}^{-1}$ и $\gamma_p = 150 \text{ cm}^{-1}$ при $\gamma_{ph} = 11 \text{ cm}^{-1}$ для $E \perp C$.

Полученные в работе параметры монокристалла ZnO позволяют прогнозировать их оптические свойства в широком диапазоне концен-

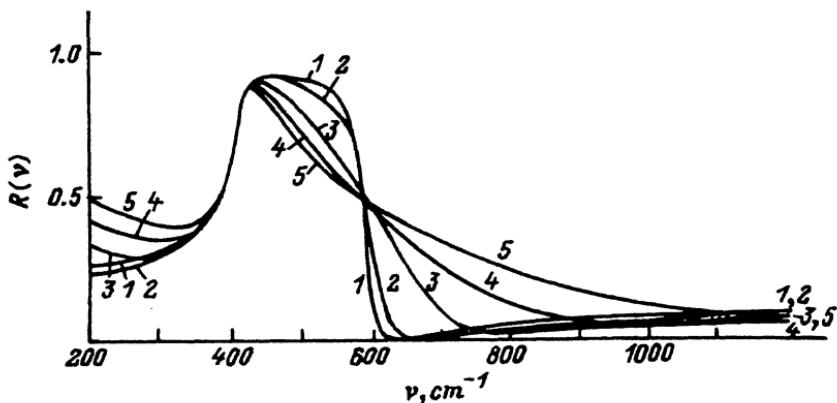


Рис. 5. Расчетные спектры $RT(\nu)$ ZnO.

$E \perp C$, $\gamma_{ph\perp} = 11 \text{ cm}^{-1}$, $\nu_{p\perp} = \gamma_{p\perp}$. 1 — $\nu_{p\perp} = 1$, 2 — 250, 3 — 500, 4 — 750, 5 — 1000 cm^{-1} .

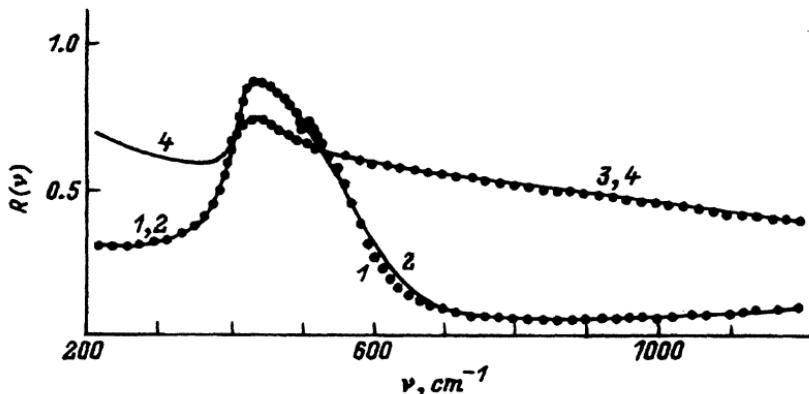


Рис. 6. $R(\nu)$ ZnO при $E \perp C$.

Образец ZC1M: 1 (точки), 2 (линия) — расчет при $\nu_{p\perp} = 605 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{ph\perp} = 14 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{p\perp} = 1020 \text{ cm}^{-1}$, $\delta = 2.0 \cdot 10^{-3}$. Образец ZO9: 3 (точки), 4 (линия) — расчет при $\nu_{p\perp} = 2115 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{ph\perp} = 40 \text{ cm}^{-1}$, $\gamma_{p\perp} = 1480 \text{ cm}^{-1}$, $\delta = 1.9 \cdot 10^{-3}$.

траций носителей зарядов. На рис. 5 показаны теоретические спектры ИК отражения ($E \perp C$) при $\gamma_{ph} = 11 \text{ cm}^{-1}$, данных табл. 1 и значениях $\nu_p = \gamma_p$ от 1 до 1000 cm^{-1} (1–5). Видны существенные изменения спектров при концентрациях 10^{18} – 10^{20} cm^{-3} . Максимальное изменение наблюдается в области 500 – 900 cm^{-1} .

На рис. 6 представлены экспериментальные и расчетные спектры $R(\nu)$ сильно легированных образцов ZC1M и ZO9 при $E \perp C$. Результаты сравнения этих спектров показаны в табл. 2. Форма спектров качественно согласуется с расчетом. Для кривой 1 максимальное отклонение от расчетной $R(\nu)$ (2) наблюдается в области 500 – 700 cm^{-1} (рис. 1–3). Мы связываем это отклонение с зависимостью коэффициента затухания плазмон-фононной моды от частоты. Концентрации электронов в образцах ZC1M и ZO9 $4.2 \cdot 10^{18}$ и $5.0 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ (табл. 3) рассчитаны с учетом представленных выше допущений на основании данных табл. 2. В таблице однозначно проявляется зависимость коэффициентов затухания поперечных оптических фононов γ_{ph} и плазмонов γ_p от

Таблица 2

Параметры образцов ZnO, полученные при
сравнении экспериментальных и расчетных $R(\nu)$

Номер образца	Образец	ν_p, cm^{-1}		γ_p, cm^{-1}		$\gamma_{ph}, \text{cm}^{-1}$		$\delta \cdot 10^3$		$\frac{\gamma_{p\perp}}{\gamma_{p\parallel}}$
		$E \perp C$	$E \parallel C$	$E \perp C$	$E \parallel C$	$E \perp C$	$E \parallel C$	$E \perp C$	$E \parallel C$	
1	ZO2-3	90	100	150	170	11	11	2.9	2.9	0.88
2	ZO1-3	240	250	280	260	13	13	3.0	3.6	1.08
3	ZO6-B	420	480	406	350	21	21	3.1	3.2	1.16
4	ZC1M	605	-	1020	-	14	-	2.0	-	-
5	ZO9	2115	-	1480	-	40	-	1.9	-	-

плазменной частоты ν_p . Величина $\gamma_{p\perp}$ изменяется от 150 до 1480 cm^{-1} для сильно легированных ZnO. Аналогичная зависимость γ_{ph} и $\gamma_{p\perp}$ от ν_p зарегистрирована в сильно легированных монокристаллах SiC 6Н [6].

Практически во всех спектрах $R(\nu)$ для кристаллов ZnO, полученных гидротермальным методом, присутствует полоса колебаний на частоте 504 cm^{-1} (рис. 1–3, 6). Она имеет различную контрастность при $E \perp C$ и $E \parallel C$ и моделируется осциллятором на частоте 504 cm^{-1} при силе осциллятора 0.026 ($E \perp C$) и 0.04 ($E \parallel C$) для ZO2-3 (табл. 4, № 1 и 2). Коэффициенты затухания осциллятора соответственно $\gamma_{2\perp} = 8$ и $\gamma_{2\parallel} = 9 \text{ cm}^{-1}$. Природа полосы требует дальнейших исследований. Одной из причин проявления ее в $R(\nu)$ может быть снятие правила запрета (вследствие наличия механических напряжений в кристалле) с моды, которая обычно не проявляется в ИК и КРС-спектрах.

Для ZnO есть области спектра $R(\nu)$, где не удается смоделировать совпадения с ним расчетного $R(\nu)$ в рамках одноосцилляторной модели (рис. 1). Эти области спектра 380–420 cm^{-1} при $E \parallel C$ и 400–460 cm^{-1} при $E \perp C$ существенно зависят от качества обработки поверхности и связаны с тонким нарушенным слоем у поверхности кристалла [6]. Точного совпадения расчетного и экспериментального спектров $R(\nu)$ можно добиться при введении в модель тонкого приповерхностного слоя

Таблица 3

Электрофизические параметры монокристаллов ZnO, выращенных гидротермальным способом

Номер образца	Образец	n, cm^{-3}	$\mu, \text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$		$\sigma \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$		m_{\parallel}	$\frac{m_{\perp}}{m_{\parallel}}$
			$E \perp C$	$E \parallel C$	$E \perp C$	$E \parallel C$		
1	ZO2-3	$9.3 \cdot 10^{16}$	150	167	22	25	0.21	1.23
2	ZO1-3	$6.6 \cdot 10^{17}$	80	96	85	101	0.23	1.13
3	ZO6-B	$2.0 \cdot 10^{18}$	74	50	237	243	0.22	1.18
4	ZC1M	$4.2 \cdot 10^{18}$	2.2	-	148	-	-	-
5	ZO9	$5.0 \cdot 10^{19}$	1.5	-	1250	-	-	-

Таблица 4

Дополнительные параметры многоосцилляторной модели слоя ZnO на кристалле ZnO. Толщина слоя $d = 0.2 \mu m$ ($\text{№} 3-7$ для слоя)

Номер	Образец	ν_{T2} , cm^{-1}	$\Delta\epsilon_2$	γ_2/ν_{T2}
1	$E \perp C$	504	0.026	0.0159
2	$E \parallel C$	504	0.04	0.0178
3	$E \parallel C$	402	0.00416	0.062
4	$E \parallel C$	410	0.0416	0.063
5	$E \parallel C$	420	0.0083	0.059
6	$E \parallel C$	425	0.54	0.082
7	$E \parallel C$	435	0.051	0.103

толщиной $0.2 \mu m$ и пяти осцилляторов с параметрами, указанными (для $E \parallel C$) в табл. 4 ($\text{№} 3-6$).

Для гексагональных кристаллов с пространственной группой $P6_3mc$ теоретико-групповой анализ предсказывает 3 акустические и 9 оптических ветвей [9,10]. Из 9 оптических ветвей два колебания типа B_1 неактивны ни в КРС, ни в ИК диапазоне, два двукратно вырожденных колебания E_2 активны только в КРС, а двукратно вырожденные колебания типа E_1 и A_1 активны как в ИК, так и в КРС [4,7,8]. Поскольку в ZnO между атомами осуществляется смешанная ионно-ковалентная связь (63% ионной связи [1]), то дальнодействующее кулоновское взаимодействие приводит к расщеплению колебаний типа A_1 и E_1 на продольные и поперечные составляющие. Частоты поперечных колебаний E_1 и A_1 соответственно $\nu_{T\perp}$ и $\nu_{T\parallel}$, а частоты продольных колебаний $\nu_{L\perp}$ и $\nu_{L\parallel}$.

Для обыкновенного и необыкновенного лучей могут быть записаны соотношения Лиддена–Сакса–Теллера (ЛСТ)

$$\varepsilon_{0\perp} = \varepsilon_{\infty\perp} (\nu_{L\perp}/\nu_{T\perp})^2, \quad \varepsilon_{0\parallel} = \varepsilon_{\infty\parallel} (\nu_{L\parallel}/\nu_{T\parallel})^2.$$

Для ZnO, согласно [7],

$$\nu_{L\parallel} - \nu_{T\parallel} = 199 \text{ cm}^{-1}, \quad \nu_{L\perp} - \nu_{T\perp} = 178 \text{ cm}^{-1},$$

$$\nu_{L\parallel} - \nu_{L\perp} = 12 \text{ cm}^{-1} (18 \text{ cm}^{-1} [4]), \quad \nu_{T\parallel} - \nu_{T\perp} = 33 \text{ cm}^{-1} (25 \text{ cm}^{-1} [4]),$$

$$|\nu_{L\parallel} - \nu_{T\parallel}|, \quad |\nu_{L\perp} - \nu_{T\perp}| \gg |\nu_{L\parallel} - \nu_{L\perp}|, \quad |\nu_{T\parallel} - \nu_{T\perp}|.$$

Это означает, что в ZnO электростатические силы в кристалле больше сил, вызванных анизотропией короткодействующих взаимодействий. Они определяют анизотропию частот колебаний в кристалле. На основе литературных данных для $\varepsilon_{\infty\parallel}$ авторы [7] рассчитали с учетом соотношений ЛСТ значения для $\varepsilon_{0\parallel} = 8.63$ и $\varepsilon_{0\perp} = 7.55$. Однако частоты колебаний получены при охлаждении образцов парами жидкого гелия.

В работе [8] в спектре КРС при 298 К проявляется мода A_1 $\nu_{T\parallel} = 380 \text{ cm}^{-1}$ (что совпадает с данными [7]), $\nu_{L\parallel} = 574 \text{ cm}^{-1}$,

$\nu_{T\perp} = 405 \text{ cm}^{-1}$ и $\nu_{L\perp} = 592 \text{ cm}^{-1}$. Расхождения данных с [7] вызваны, по-видимому, неточностями в определении температуры образцов при освещении лазерным излучением. В [10] на основании экспериментальных данных [7,11] рассчитаны теоретические колебательные спектры ZnO. Результаты использованы для расчета в модели валентных сил дисперсионных зависимостей колебаний и плотности состояний для характерных направлений в кристалле ZnO. В работе учтены неточности расчетов [12]. Можно ожидать, что данные КРС для ν_T и ν_L , подтвержденные совпадением значений, наиболее достоверны. Такими оказались $\nu_{T\parallel} = 380 \text{ cm}^{-1}$, $\nu_{L\perp} = 591 \text{ cm}^{-1}$. Для $\nu_{T\perp}$ использовано среднее значение $\nu_{T\perp} = 412 \text{ cm}^{-1}$ и выбрано $\nu_{L\parallel} = 570 \text{ cm}^{-1}$. Эти данные (табл. 1) с точностью до $\pm 2 \text{ cm}^{-1}$ согласуются с наиболее достоверными литературными данными. Значительны расхождения между величинами $\varepsilon_{0\perp,\parallel}$ от 7.5 до 12 и от 2 до 4 для $\varepsilon_{\infty\perp,\parallel}$ [2-4,7,8]. Выбор значений $\varepsilon_{\infty\perp,\parallel}$ основан на точных измерениях показателя преломления в видимой области [11]. Значение $\varepsilon_{0\perp,\parallel}$ нами получено при использовании соотношений ЛСТ и сравнении экспериментальных и теоретических спектров $RE(\nu)$ и $RT(\nu)$ (табл. 1).

Вопрос о коэффициентах затухания фононов при $T = 293 \text{ K}$ остается открытым.

Для окиси цинка взаимодействие излучения со свободными носителями зарядов исследовано в ряде работ, например [2,13-17]. Оптические измерения позволили получить значение эффективной массы электронов $m^x = (0.265 \pm 0.015)m_e$, где m_e — масса свободного электрона. В [16] по фарадеевскому вращению плоскости поляризации излучения на высоких частотах получено $m^x = 0.24m_e$. На низкой частоте так называемая поляронная эффективная масса равна $m_p = 0.29m_e$. В [17] авторы исследовали Холл-эффект в легированном ZnO. В рамках водородоподобной модели мелкого донора получено $m_H = 0.27m_e$; предполагается, что $m_p = m_H$, тогда как «дрейфовая» эффективная масса электрона $m_d = 0.23m_e$. Наиболее подробно вопрос анизотропии эффективной массы электронов исследован в работе [15]. Авторы использовали зеемановское расщепление состояний и циклотронный резонанс. Последний дал $m_{\parallel}^x = 0.28m_e$ и $m_{\perp}^x = 0.24m_e$, данные по зеемановскому расщеплению уровней соответствуют $m_{\parallel}^x = 0.3m_e$ при $H \parallel C$ и $m_{\perp}^x = 0.34m_e$ при $H \perp C$ для мелких примесей при $T = 1.3 \text{ K}$. Аномально малой оказалась величина эффективной массы электронов $m^x = 0.06m_e$, полученная на основе анализа спектров ИК отражения [2]. Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что эффективная масса электрона в ZnO имеет значения от $0.24m_e$ до $0.34m_e$ [4,13-17], а данные [2] не точны.

При расчете спектров ИК отражения сильно и слабо легированных монокристаллов ZnO использован опыт дисперсионного анализа спектров $R(\nu)$ карбида кремния SiC 6Н, который также относится к группе вюрцитита $P6_3mc$ [6] и обладает анизотропией электрофизических параметров. Отличительной особенностью ZnO оказалась более сильная анизотропия колебательных спектров решетки (табл. 1, рис. 1). Однако ожидавшиеся большие коэффициенты анизотропии параметров

плазменной системы ZnO не подтверждены. При сравнении $R(\nu)$ слабо легированных ZnO анизотропия частот ν_T и ν_L очевидна. Увеличение концентрации электронов в образцах приводит к уменьшению относительных значений $R_{\perp}(\nu)/R_{\parallel}(\nu)$ (рис. 3, 4), хотя наличие анизотропии параметров $\nu_{p\perp}$, $\gamma_{p\perp}$ и $\nu_{p\parallel}$ и $\gamma_{p\parallel}$ очевидно (табл. 2). Точность определения этих параметров для образца ZO2-3 занижена вследствие малого вклада плазмонов в $\varepsilon(\nu)$ при $n = 9.3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ($\nu_{p\perp} = 90 \text{ см}^{-1}$) в указанном диапазоне частот ИК излучения (рис. 1).

Расчетные спектры $R(\nu)$ (рис. 5) показывают, что заметное влияние на величину коэффициента отражения ZnO оказывают электроны при концентрациях $n \geq 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Для $\nu_{p\perp} = 250 \text{ см}^{-1}$ при $\nu_{p\perp} = \gamma_{p\perp}$ наблюдаются существенные различия (кривые 1, 2) в области частот 200–350 и 580–700 cm^{-1} . Это означает, что при $\nu_{p\perp} > 200 \text{ см}^{-1}$ дисперсионный анализ спектров $R(\nu)$ позволяет с достаточной точностью определять частоту плазменного резонанса и коэффициенты затухания плазмонов, а также их коэффициенты анизотропии. Данные измерений 9 образцов ZnO позволяют оценить величину $\gamma_{p\perp}/\gamma_{p\parallel} = 1.1$ и коэффициента анизотропии эффективных масс $m_{\perp}^*/m_{\parallel}^* = 1.15$.

Мы использовали наиболее достоверное значение поперечной эффективной массы $m_{\perp}^* = 0.26m_e$. Это значение и данные табл. 2 позволяют оценить по методике [6] величину продольной массы $m_{\parallel}^* = 0.22m_e$. С точностью до значения $m_{\perp}^* = 0.26m_e$ были определены концентрации электронов, подвижности и удельная электропроводность образцов (табл. 2, 3). Эти параметры отличаются на 7 %, если $m_{\perp}^* = 0.28m_e$. Представленные в табл. 3 данные для μ и σ согласуются с подобными значениями, полученными для ZnO другими исследователями [1]. Таким образом, плазмоны в монокристаллах ZnO обладают значительно меньшим коэффициентом анизотропии, чем в SiC 6Н [6], что, по-видимому, связано с более простой структурой дисперсионных зависимостей [10].

В работе впервые получены зависимости коэффициентов затухания оптических фононов ZnO $\gamma_{ph\perp,\parallel}$ от частоты плазменного резонанса (табл. 2). Повышение концентрации электронов до $5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ приводит к увеличению γ_{ph} от 11 до 40 cm^{-1} . Анализ спектров показал, что $\gamma_{ph\perp} = \gamma_{ph\parallel} = \gamma_{ph}$. Изменение концентрации электронов связано с наличием междуузельного цинка [1]. Лишь 0.1 % атомов цинка выступает в качестве активного донора. Поэтому такое значительное количество междуузельного цинка в кристалле приводит к высокой концентрации дефектов, что сказывается в увеличении коэффициентов затухания фононов и плазмонов (табл. 3).

Таким образом, в работе приведены результаты исследований оптическим методом электрофизических свойств монокристаллов окиси цинка, выращенного гидротермальным способом. Методом дисперсионного анализа спектров $R(\nu)$ при использовании ПЭВМ получены взаимосогласованные параметры кристалла. Впервые обнаружена полоса колебаний на частоте 504 cm^{-1} , интенсивность которой зависит от поляризации ИК излучения. Измерены анизотропия эффективных масс электронов $m_{\perp}^*/m_{\parallel}^* = 1.15$ и анизотропия коэффициентов зату-

хания плазмонов $\gamma_{p\perp}/\gamma_{p\parallel} = 1.1$. При расчетах использовано значение $m_{\perp}^* = 0.26m_e$. Полученные значения для подвижности и удельной электропроводности ZnO хорошо согласуются с литературными данными.

Авторы выражают благодарность Л.Н. Демьянец и И.П. Кузьминой за предоставление образцов ZnO для измерений и полезное обсуждение полученных результатов.

Список литературы

- [1] Кузьмина И.П., Никитенко В.А. Окись цинка. Получение и оптические свойства. М.: Наука, 1984. 166 с.
- [2] Collins R.J., Kleinman D.A. // J. Phys. Chem. Solids. 1959. V. 11. N 1. P. 190–194.
- [3] Heltemes E.C., Swinney H.L. // J. Appl. Phys. 1967. V. 47. N 8. P. 2387–2388.
- [4] Damen T.C., Porto S.P.S., Tell B. // Phys. Rev. 1966. V. 142. N 2. P. 570–574.
- [5] Борн М., Кунь Х. Динамическая теория кристаллических решеток. М.: ИЛ. 1958. 488 с.
- [6] Мельничук А.В., Пасечник Ю.А. // ФТТ. 1992. Т. 34. № 2. С. 423–428.
- [7] Arquello C.A., Rousseau D.L., Porto S.P.S. // Phys. Rev. 1969. V. 181. N 3. P. 1351–1363.
- [8] Виноградов Е.А., Мельник Н.Н., Суркан А.Е., Қичерман Л.В. // ЖПС. 1969. Т. 26. № 6. С. 1059–1062.
- [9] Loudon R. // Advan. Phys. 1964. V. 13. N 2. P. 423–432.
- [10] Мельничук С.В., Соколов В.И., Суркова Т.П., Чернов В.М. // ФТТ. 1991. Т. 33. № 11. С. 3247–3254.
- [11] Thoma K., Dorner B., Duesing G., Wedenev W. // Solid State Commun. 1974. V. 15. N 3. P. 1111–1119.
- [12] Bond W.L. // J. Appl. Phys. 1965. V. 5. N 6. P. 1674–1677.
- [13] Weiger R.L. // Phys. Rev. 1966. V. 152. N 2. P. 736–739.
- [14] Finkenraft H., Krug K., Uhle N. // Phys. Stat. Sol. B. 1976. V. 78. N 1. P. 27–30 (K27).
- [15] Button K.J., Cohn D.R., Ortenbert M.V. et al. // Phys. Rev. Lett. 1972. V. 28. N 8. P. 1637–1638.
- [16] Baer W.S. // Phys. Rev. 1967. V. 154. N 1. P. 785–787.
- [17] Hutson A.R. // J. Phys. and Chem. Solids. 1959. V. 8. N 1. P. 467–470.

Украинский государственный педагогический
университет им. П.М. Драгоманова
Киев

Поступило в Редакцию
1 марта 1994 г.